

クリアーニトリル手袋 MS-CGR

NVR・残渣・残留イオン防止/Class100クリーン仕様

特 徴

- ワイピング時のNVR(非揮発性残留物)を防止。
- 陰イオン・陽イオンの残留を防止。
- 大気中に粉塵(パーティクル)発生がほとんど無い。
- 柔らかく強力なグリップがあり、手にフィットします。

用 途

- ハイレベルなクリーンルームで使用する手袋。
- HDDハードディスクなどのワイピング清掃。
- 液晶・半導体・精密部品などを扱う作業。
- 手袋が原因のトラブルを発生させたくない時。



残留陽イオン	
元素名	濃 度
Li ⁺	未検出
Na ⁺	未検出
NH ₄ ⁺	未検出
K ⁺	未検出
Ca ⁺	未検出
Mg ⁺	未検出

測定限界…0.05ppm
(測定値であり、保証値ではありません。)

残留陰イオン	
元素名	濃 度
PO ₄ ⁻	未検出
F ⁻	未検出
Cl ⁻	未検出
NO ₂ ⁻	未検出
Br ⁻	未検出
NO ₃ ⁻	未検出
SO ₄ ⁻	未検出

測定限界…0.01ppm
(測定値であり、保証値ではありません。)

NVRコンタミネーション(汚染) データ比較	
一般ニトリル(ホワイト)	クリアーニトリルMS-CGR
1656.25 [ng/cm ²]	15.63 [ng/cm ²]

発生粉塵粒子(パーティクル)測定データ [個/CF]							
粒 径	0.3μm ≦	0.5μm ≦	0.7μm ≦	1.0μm ≦	2.0μm ≦	3.0μm ≦	6.0μm ≦
1双目	4	0	0	0	0	0	0
2双目	2	0	0	0	0	0	0
3双目	5	2	2	1	0	0	0
4双目	5	5	2	1	1	1	1
5双目	3	1	0	0	0	0	0
平均値	3.8	1.6	0.8	0.4	0.2	0.2	0.2

※0.3μm ≦の数値は、0.3μm以上の粉塵すべての合計数です。(0.5μmや0.7μmの粉塵数もカウントしています)

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.

※このカタログ記載の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。記載の仕様は、2008年1月現在のものです。